1. **口井 敏匡, 四柳 浩之 :** 半導体集積回路，スキャン回路設計方法，テストパターン生成方法，および，スキャンテスト方法, 特願2004-225962 (2004年8月), 特開2006-047013 (2006年2月), .
2. **橋爪 正樹, 一宮 正博 :** 電源電流による検査容易化論理回路, 特願2006-112885 (2004年10月), .